



Главный редактор

**В.В. Ключев** – проф., акад. РАН

Заместители главного редактора:

**В.Г. Шевалдыкин** – д-р техн. наук

**П.Е. Клейзер**

Редакционный совет:

**Б.В. Артемьев**

**В.Т. Бобров**

**О.Н. Будадин**

**В.П. Вавилов**

**В.А. Голенков**

**Э.С. Горкунов**

**И.Н. Жесткова**

**Г.В. Зусман**

**В.В. Коннов**

**Н.Н. Коновалов**

**Н.В. Коршакова**

**В.Н. Костюков**

**Н.Р. Кузелев**

**В.И. Матвеев**

**Г.А. Нуждин**

**К.В. Подмастерьев**

**А.В. Полулан**

**Ю.С. Степанов**

**Л.Н. Степанова**

**В.В. Сухоруков**

**В.М. Труханов**

**Ю.К. Федосенко**

**М.В. Филинов**

**В.Е. Шатерников**

**Г.С. Шелихов**

Ответственные за подготовку  
и выпуск номера:

**П.Е. Клейзер**

**Д.А. Елисеев**

**С.В. Сидоренко**

Журнал входит в перечень изданий,  
утвержденных ВАК РФ для публикации  
трудов соискателей ученых степеней.

При перепечатке материалов ссылка на  
журнал «Контроль. Диагностика»  
обязательна.

За содержание рекламных материалов  
ответственность несет рекламодатель.

Журнал зарегистрирован в Федеральной  
службе по надзору в сфере массовых  
коммуникаций, связи и охраны культурно-  
го наследия Российской Федерации.  
Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-46328

Журнал распространяется по подписке,  
которую можно оформить в издатель-  
стве или в любом почтовом отделении.

Индексы по каталогам агентств:

«Роспечать» – 47649;

«Пресса России» – 29075;

«Почта России» – 60260.

ООО «Издательский дом «Спектр»  
119048, Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1

Тел.: (495) 514 76 50, 8 (916) 676 12 38

Http://www.td-j.ru; www.idspektr.ru

E-mail:td@idspektr.ru, tdjpost@gmail.com

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Дубов А.А.</b> К 20-летию предприятия ООО «Энергодиагностика». История возникновения и развития . . . . .	8
<b>Баранов П.Ф., Бориков В.Н.</b> Дистанционная поверка и калибровка средств измерений . . . . .	13
<b>Гольдштейн А.Е., Булгаков В.Ф., Кренинг Х.-М.В.А.</b> Система вихретоковой дефектоскопии с возбуждением разночастотных вихревых токов циркулярного и продольного направлений . . . . .	17
<b>Бритова Ю.А., Дмитриев В.С., Васильцов А.А., Костарев И.С.</b> Влияние жесткости силовых элементов конструкции на величину критической скорости исполнительного органа на базе управляемого по скорости двигателя-маховика . . . . .	24
<b>Дохтуров В.В., Юрченко В.И., Юрченко А.В.</b> Контроль параметров омических контактов в процессе их термообработки . . . . .	27
<b>Кагиров А.Г., Романенко С.В.</b> Схема измерения электропроводности растворов миниатюрными кондуктометрическими датчиками . . . . .	30
<b>Калиниченко Н.П., Калиниченко А.Н., Конарева И.С.</b> Универсальный контрольный образец для капиллярной дефектоскопии . . . . .	34
<b>Суржиков А.П., Притулов А.М., Лысенко Е.Н., Власов В.А., Васендина Е.А.</b> Контроль фазового состава литийзамещенных ферритов методом ТГ(М)/ДТГ(М) . . . . .	37
<b>Назаренко О.Б.</b> Особенности диагностики электровзрывных нанопорошков металлов . . . . .	42
<b>Нестеренко Т.Г., Барбин Е.С., Коледа А.Н., Бурганова С.Я., Пересветов М.В., Колчужин В.А.</b> Диагностика перекрестных связей в двухкомпонентном микромеханическом датчике угловой скорости . . . . .	46
<b>Нестерук Д.А., Мотырева Н.В., Фалилеев А.Д.</b> Определение температуропроводности композиционных материалов по методу Паркера: влияние экспериментальных факторов на погрешность измерений . . . . .	51
<b>Лапшин Б.М., Овчинников А.Л., Чекалин А.С.</b> Оценка достоверности обнаружения утечек в трубопроводах тепловых сетей методом акустической эмиссии . . . . .	55
<b>Авдеева Д.К., Уваров А.А., Еремин В.В., Лежнина И.А., Балахонова М.В.</b> Разработка электрокардиографической аппаратуры высокого разрешения на наноэлектродах индивидуального применения с телекоммуникационным каналом передачи данных . . . . .	62
<b>Фурса Т.В., Данн Д.Д., Осипов К.Ю.</b> Разработка механоэлектрического метода определения места локализации дефекта в изделии из бетона . . . . .	66
<b>Суржиков В.П., Хорсов Н.Н.</b> Влияние напряженно-деформированного состояния образца на параметры электромагнитной эмиссии при импульсном акустическом возбуждении . . . . .	69
<b>Чернявский А.В.</b> Измерение диффузионных профилей в ионных кристаллах методом масс-спектрометрии вторичных ионов . . . . .	72